

社内標準

(技術標準)

管理基準：一般顧客用

日本エー・エム・ピー株式会社

設計目標書
 本製品は下記要件を満足するかどうか未確認です。従って、本製品がこれら要件を満足することを保証するものではありません。また、これら要件は都合により変更する場合があります。詳細は、当社技術部にお問い合わせ下さい。
 本書中に「本規格は」と引用している箇所はすべて「本設計目標書は」と読み換えて適用願います。

1. 適用範囲

本規格はプリント基板に挿入して使用されるアンプ・ラッチ・アクションピン・ヘッダー・コネクタについて規定し表1に名称と型番を示す。

表1

名 称	型 番
アンプ・ラッチ・アクションピン・ヘッダー	□-174584-□

2. 必要条件

2.1 構造・材料及び仕上げ

本規格で規定している製品は該当する製品図面に規定されている構造・寸法・材料及び仕上げを有すること。

2.2 定格

- 1) 電流：1極当り1A以下
- 2) 電圧：250VAC
- 3) 温度：-20°C~85°C (温度上昇含む)

2.3 一般性能

表2に示す一般性能に全て合格しなければならない。

			作成： 3/28 '88 T. Sasaki	分類： 設計目標書
			検閲： 3/28 '88 R. J. P. [Signature]	コード： 108-5265 改訂 0 ₁
0 ₁	設計目標書	K.N. [Signature]	承認： 3/28 '88 R. J. P. [Signature]	名称： アンプ・ラッチ・アクションピン・ヘッダー・コネクタ
0	RFA-1266	T. [Signature]	改訂 年月日	
改訂	改訂記録	作成 検閲 承認	年月日	
配布	昭和 年 月 日 制定	5 頁中 1 頁		

8803 TOS

表2 一般性能

項番	試験項目	規格値	試験方法
2.3.1	総合抵抗 (ローレベル)	8mΩ以下	図1に示す測定回路において回路電流100mA以下、開放電圧50mV以下にて測定する。
2.3.2	耐電圧	絶縁破壊またはフラッシュホバを生じないこと。	MIL-STD-202E試験法301に準じ隣接コネクタ間にAC1000V1分間印加して測定する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.3	絶縁抵抗	初期値 5000MΩ以上 試験後 1000MΩ以上	MIL-STD-202E試験法302、条件Bに準じ、隣接コネクタ間にDC500Vを印加して測定する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.4	振動	物理的損傷が生じないこと。	MIL-STD-202E試験法204C、条件Aに準じて試験する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.5	衝撃	物理的損傷が生じないこと。	MIL-STD-202E試験法213B、条件Iに準じて試験する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.6	アクションピン挿入力	22.7 kg以下	図2に示す標準試験基板に適合したプリント基板に1極毎に挿入して測定する。
2.3.7	アクションピン保持力	3 kg以上	図2に示す標準試験基板に適合したプリント基板に挿入されたアクションピンを、挿入方向と逆側から押して測定する。
2.3.8	アクションピンに対する ピン保持力	0.5 kg以上	ピンの挿入方向と逆側から押して測定する。図3参照
2.3.9	熱衝撃	耐電圧試験の規格値を満足すること。	MIL-STD-202E試験法107D、条件Aに準じ試験する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.10	耐湿性	絶縁抵抗 1000MΩ以上	MIL-STD-202E試験法106Dに準じ試験する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。

分類：

設計目標書

標準の名称：

アンブ・ラッチ・アクションピン・ヘッダー・コネクタ

標準のコード：

108-5265

改訂

01

2 頁

5 頁中

項番	試験項目	規格値	試験方法
2.3.11	塩水噴霧	物理的損傷を生じないこと。	MIL-STD-202E試験法101D、条件Bに準じ試験する。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。
2.3.12	亜硫酸ガス	物理的損傷を生じないこと。	ガス濃度10±3PPM、湿度90%、温度は室温とし24時間さらす。但し、コネクタはプリント基板に取付ける。

2.4 試験順序

表3

項番	試験項目	試験グループ	
		1	2
2.3.1	総合抵抗(ローレベル)	① ⑫	
2.3.2	耐電圧	③ ⑤	
2.3.3	絶縁抵抗	② ⑨	
2.3.4	振動	⑥	
2.3.5	衝撃	⑦	
2.3.6	アクションピン挿入力		②
2.3.7	保持力		③ ⑤
2.3.8	ハウジングに対するピン保持力		①
2.3.9	熱衝撃	④	④
2.3.10	耐湿性	⑧	
2.3.11	塩水噴霧	⑩	
2.3.12	亜硫酸ガス	⑪	

3. 品質保証条件

3.1 試料

試料は完全に管理された製品を使用し、プリント基板を使用する場合は本コネクタ推奨基板に適合したものを使用すること。

3.2 試験条件

下記に示す環境条件のもとで試験を行うこと。

温度 : 15~35°C

湿度 : 45~75%

気圧(水銀柱) : 650~800mmHg

分類： 設計目標書	標準の名称： アンブ・ラッチ・アクションピン・ハッター・コネクタ	標準のコード： 108-5265	改訂 01	3 頁 5 頁中
--------------	-------------------------------------	---------------------	----------	-------------

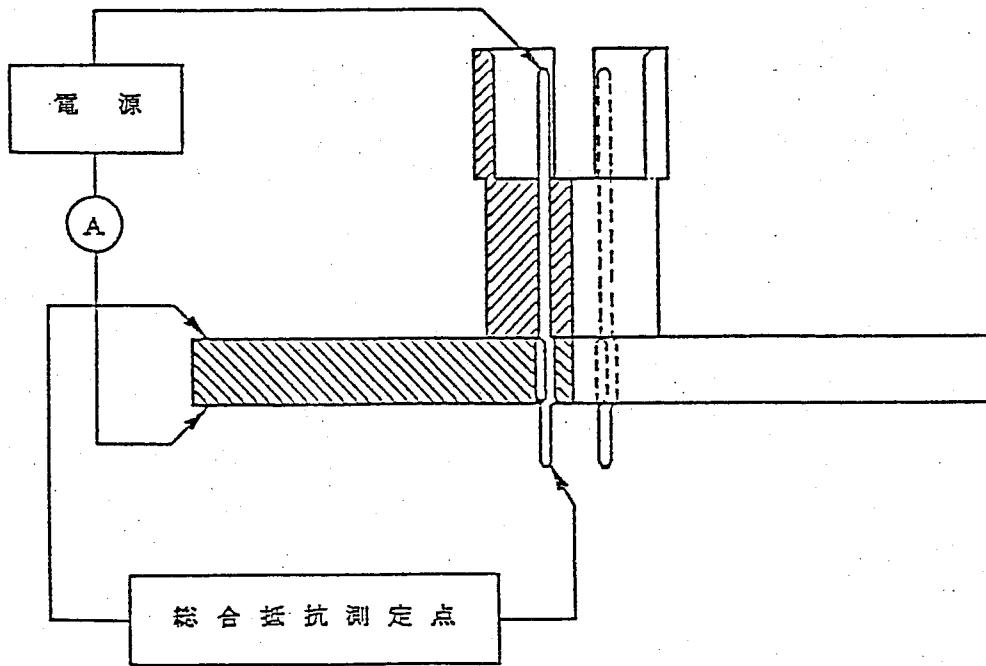


図1 総合抵抗測定点

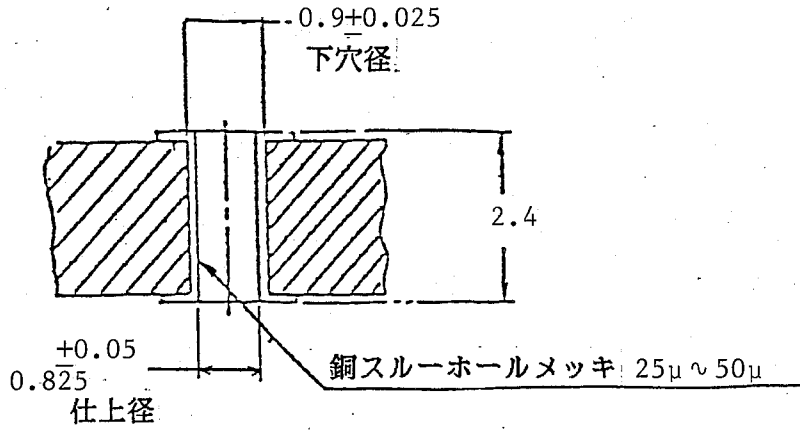


図2 標準試験基板

分類： 設計目標書	標準の名称： アンブ・ラッチ・アクションピン・ハッター・コネクタ	標準のコード： 108-5265	改訂	4 頁
			01	5 頁中

0803 IUS

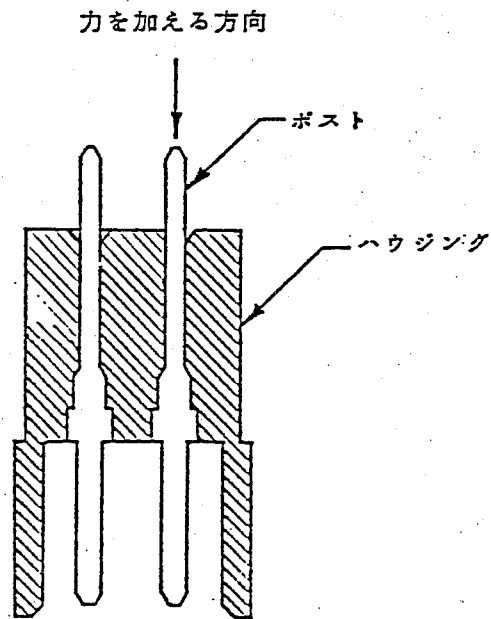


図3 ハウジングに対するピン保持力試験

分類：設計目標書

標準の名称：アンブ・ラッチ・アクションピン・ヘッド・コネクタ

標準のコード：108-5265

改訂	5 頁
01	5 頁中

8803 IUS